



膜厚計 SWT-8000 II / 校正書付(R2S P0025 001)

- 測定用途に合わせて接続プローブを差替えるだけで、鉄及び非鉄の両金属素地上の皮膜を簡単に測定できます。
- LCD画面上に操作手順がわかりやすくガイド表示されて、シンプルキーで簡単安心に操作できます。
- ゼロ調整・標準調整はワンタッチボタンの簡単操作です。

本体



仕様

商品コード	R2S 00025 001	R2S P0025 001
メーカー	サンコウ電子研究所	
型式	SWT-8000 II	
校正書写し	なし	あり
測定範囲	磁気誘導式	0~2.50mm
	渦電流式	0~2.00mm
表示分解能	共通	切替 1 μm(0~999 μm) / 0.1 μm : 0~400 μm / 0.5 μm : 400~500 μm
	磁気誘導式	0.01mm(1.00~2.50mm)
	渦電流式	0.01mm(1.00~2.00mm)
測定精度 (平滑面に対して)	共通	0~100 μm : ±1 μm または指示値の±2% 以内
	磁気誘導式	101 μm~2.50mm : ±2%以内
	渦電流式	101 μm~2.00mm : ±2%以内
プローブ	磁気誘導式	1点定圧接触式、Vカット付き、φ13×48mm
	渦電流式	1点定圧接触式、Vカット付き、φ13×47mm
検量線メモリ	磁気誘導式	1本
	渦電流式	1本
検量線校正 (CAL)	2点校正式 ゼロ点: 素地を使用する校正 標準調整点: 素地と標準厚板を使用する校正	
使用温度	0~40℃(結露しないこと)	
電源	単3形乾電池×2本 オートパワーオフ機能付き	
寸法	全幅 W	72mm
	奥行 D	156mm
	全高 H	30mm
質量	約200g	

校正書付(商品コード: R2S P0025 001)について

当該機器は校正機関での年次校正を行っております。
レンタル料に校正機関の校正料金も含まれております。

用途

鉄素地用測定 (磁気誘導式プローブ)

- 鉄素地上に処理された塗装、ライニングなどの絶縁性皮膜及び非磁性金属皮膜の厚さを非破壊測定します。

使用分野

塗装	機器、自動車、船舶、橋梁、鉄鋼構造物など
ライニング	樹脂、タールエポキシ、ゴム、ホーロー、シートなど
メッキ	亜鉛、銅、クロム、スズなど
その他	メタリコン、パーカライジング、酸化膜、容射膜など

- ▲測定できるメッキは非磁性メッキのみです。
電解ニッケルメッキは測定できません。

用途

非鉄素地用測定 (渦電流式プローブ)

- 比較的汎用な測定物の非鉄金属素地上の絶縁性皮膜の厚さを測定します。

使用分野

塗装	アルミ製品、ステンレス製の内外装建材、機械、タンクなど
陽極酸化皮膜(アルマイト)	アルミ製品、アルミサッシ、台所用品、家電製品など
ライニング	各種機器、部品、化学プラントなど

付属品

- ・標準厚板 ・テスト用ゼロ板 (電磁用、渦電流用) ・弊社検査成績書
- ・プローブ (電磁用Fe-2.5、渦電流用Nfe-2.0) ・収納袋